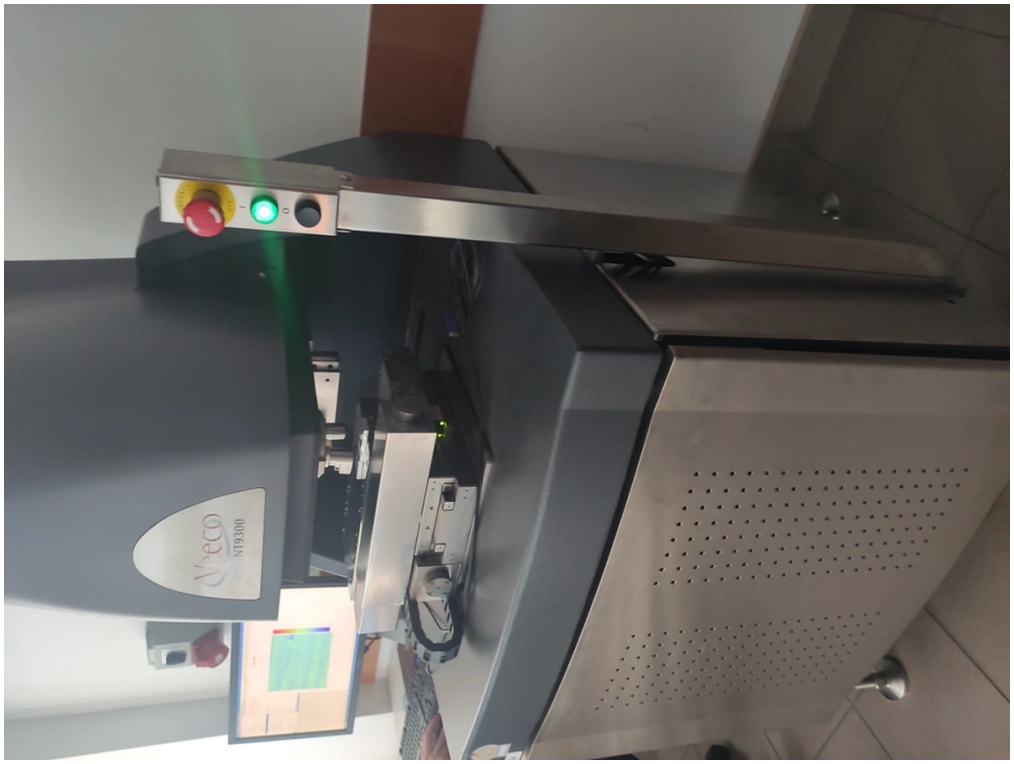
Oferta Badawcza AGH

Profilometr optyczny



Opis techniczny:

Tryb pionowej interferometrii skanującej, tryb interferometrii przesunięcia fazowego oraz tryb łączący obydwie powyższe techniki. Pionowy zakres skanowania 10 mm ze sprzężeniem zwrotnym w zamkniętej pętli dla całego zakresu skanowania. Kamera o matrycy 640 x 480 pikseli o szybkości 60 klatek na sekundę. Rewolwer sterowany z poziomu oprogramowania na 3 soczewki zmieniające pole obserwacji. Zmotoryzowany stolik próbki XY, o zakresach przesuwu 200 mm x 200 mm, sterowany dedykowanym oprogramowaniem do sklejania mniejszych obrazów w większe. Zmotoryzowany mechanizm regulacji pochyłu realizowany poprzez pochył głowicy pomiarowej. System izolacji antywibracyjnej (z kompresorem). Komputer PC z oprogramowaniem sterującym oraz oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych, do analizy obrazu oraz typowymi funkcjami analitycznymi do badań tribologicznych. • Obiektywy interferencyjne 5x i 20x. Zasilacz awaryjny UPS.

Nazwa handlowa: Profilometr optyczny WYKO NT930

Więcej szczegółów: /equipment/profilometr-optyczny/

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Rozmus-Górnikowska Magdalena

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-rozmus-gornikowska-6351.html

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Grupa / laboratorium / zespół: KIPiM, laboratorium badania własności materiałów KIPiAM https://kipiam.agh.edu.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2023 11:49

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2010

Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

Urządzenie zapewnia możliwość pomiarów topografii powierzchni z wysoką rozdzielczością dla szerokiego zakresu materiałów

Możliwości pomiarowe:

• 10 mm zakres skanowania o bardzo dużej dokładności • zautomatyzowany stolik Z z zakresem 100 mm; zmotoryzowany stolik XY o zakresie przesuwu 200 mm w obu kierunkach; automatyczna regulacja pochyłu próbki • obiektyw interferometryczny Michelson 5x do pomiaru próbek o współczynniku odbicia około 20 %. Wysokość próbki nie może przekraczać 4”

Warunki udostępniania infrastruktury:

W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika Katedry IPiAM.